

固件修订记录

版本号	修订内容
V1.1.2.1.5R0 2023/4/15	<p>新特性</p> <ul style="list-style-type: none">• VNA 模式支持电子校准件• VNA 模式支持三种新的 format: Unwrap Phase/Real/Imaginary,• VNA 模式支持 Z Reflection <p>提升的功能</p> <ul style="list-style-type: none">• 当存在多个 marker 重叠时, 触屏拖动优先拖动当前 marker• VNA 模式增加 scpi 命令: Format 新增:CALCulate#[:SElected]:FORMat 新增三个参数为 UWPH/REAL/IMAG Format 为 Phase 时, 读 marker y 值:CALCulate#:FSCan:MARKer#:Y? 除返回 phase 值外同时返回 unwrap phase 值• MA 模式新增 scpi 命令: Z Reflection: Reflection:CALCulate#:TRACe#:CONVersion:FUNCTion OFF/ZREFlection PM 解调, 设置/获取解调类型:ADEMod:STYLE 设置扫描时间[:SENSe]:SWEep:TIME• 新增 scpi 命令: 退出 remote 状态:SYSTem:LOCal <p>解决的问题:</p> <ul style="list-style-type: none">• 修正 SA 模式 emi 滤波器带宽错误的问题• 修正 SA 模式设置 TG 信号幅度可能导致 TG 没有输出的问题• 修正 SA 模式 n dB 光标测量结果与 OBW 测量结果不一致的问题• 修正 SA 模式下谐波分析存在无效的频率菜单的问题• 修正 MA 模式读取模拟解调测量结果的 scpi 命令:READ:ADEMod?会多返回一个无效值的问题
V1.1.2.1.2 2022/11/1	产品初次发布